

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60747-5-3

Première édition
First edition
1997-08

**Dispositifs discrets à semiconducteurs
et circuits intégrés –**

**Partie 5-3:
Dispositifs optoélectroniques –
Méthodes de mesure**

**Discrete semiconductor devices
and integrated circuits –**

**Part 5-3:
Optoelectronic devices –
Measuring methods**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60747-5-3:1997